

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成28年9月29日 (2016.9.29)

【公表番号】特表2015-533415(P2015-533415A)

【公表日】平成27年11月24日 (2015.11.24)

【年通号数】公開・登録公報2015-073

【出願番号】特願2015-538045(P2015-538045)

【国際特許分類】

G 0 1 N 23/205 (2006.01)

G 2 1 K 1/02 (2006.01)

G 2 1 K 3/00 (2006.01)

G 2 1 K 1/00 (2006.01)

G 0 1 T 1/20 (2006.01)

G 0 1 T 7/00 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 N 23/205 3 1 0

G 2 1 K 1/02 C

G 2 1 K 3/00 S

G 2 1 K 1/00 X

G 0 1 T 1/20 C

G 0 1 T 7/00 B

【手続補正書】

【提出日】平成28年8月4日 (2016.8.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 0】

図 2 A は広帯域の分散ビームが試料の結晶粒によって回折されるときにの相対距離を示す側面図である。具体的には、光源 1 1 0 と試料 1 0 の間の距離は  $d_{ss}$  である。試料 1 0 とラウエ焦点面 5 0 の間の距離は  $d_{sd1}$  であり、試料 1 0 と投影面 5 2 の間の距離は  $d_{sd2}$  である。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 9】

3 次元結晶粒マップの再構成のために試料面に結晶粒の輪郭を再度投影する 1 つの手法は、投影面からラウエ焦点面 5 0 におけるライン焦点を通して結晶粒形状を再投影することである。そうすると、試料内の正確な結晶粒位置に関する推論とともにセットアップ（光源位置）の幾何学的形状がわかっているので、反射を生じさせる屈折率および波長を識別することができる。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 8

【補正方法】変更

## 【補正の内容】

## 【 0 0 7 8 】

場合によっては、コントローラ 1 0 5 はラウエ検出器 1 5 0 からのデータのみまたは投影面検出器 1 5 2 からのデータのみを使用して試料 1 0 を分析する。しかしながら、一般的にはラウエ検出器 1 5 0 から得た情報が試料の分析に最も役立つ。